

应用 X 射线定向仪测定晶面指数和取向的简便法

刘来保

(中国科学院安徽光学精密机械研究所)

本文介绍在 X 射线定向仪上用 CuK 辐射的两种特征谱线, 对同一晶面衍射所获得的 $\theta_{K\alpha_1} - \theta_{K\beta}$ 角差 δ 进行测定, 并与已计算好的 $\delta-d$ 表进行对照, 从而达到测定晶面指数和取向的目的。

一、原理和方法

X 射线定向仪通常用来精确测定晶片表面与已知晶面的取向偏离。对于未知晶面, 采用常规方法测定 θ_{hkl} 值是不可能的。然而利用 X

射线 $K\alpha_1$ 和 $K\beta$ 对同一晶面的衍射角差 δ 来反推相应的 θ_{hkl} 值是方便的。因为不管实际晶片表面与衍射晶面有多大偏角, 给定晶面的 δ 角差是一定的。

Popović 曾提出过在 X 射线衍射仪上, 用不同波长对某一晶面衍射测得的角差 δ 来计算 d 值的公式^[1]:

$$d^2 = \frac{\left(\frac{\lambda_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\lambda_2}{2}\right)^2 - \frac{\lambda_1\lambda_2}{2}\cos\delta}{\sin\delta}. \quad (1)$$

但计算起来很麻烦, 因此我们采取类似于晶体

表 1

$\theta_{K\alpha_1} - \theta_{K\beta}$	$d(\text{\AA})$	$\theta_{K\alpha_1}$	$\theta_{K\alpha_2}$	$\theta_{K\beta}$
3°23'59"	1.4504	32°04'42"	32°10'03"	28°40'53"
3°28'12"	1.4278	32°38'59"	32°41'25"	29°10'45"
3°32'34"	1.4062	33°12'51"	33°18'26"	29°40'16"
3°36'57"	1.3859	33°46'22"	33°52'04"	30°09'25"
3°41'19"	1.3659	34°19'33"	34°25'22"	30°38'13"
3°45'42"	1.3472	34°52'24"	34°58'20"	31°06'41"
3°50'05"	1.3292	35°24'55"	35°30'59"	31°34'50"
3°54'28"	1.3120	35°57'03"	35°03'14"	32°02'35"
3°58'50"	1.2955	36°28'49"	36°35'08"	33°29'59"
4°03'13"	1.2797	37°00'17"	37°06'43"	32°57'04"
4°07'35"	1.2646	37°31'22"	37°37'55"	33°23'47"
4°11'58"	1.2501	38°02'08"	38°08'48"	33°50'10"
4°16'21"	1.2362	38°32'34"	38°38'22"	34°16'13"
4°20'43"	1.2228	39°02'40"	39°09'35"	34°41'56"
4°25'06"	1.2099	39°32'25"	39°36'28"	35°07'19"
4°29'29"	1.1975	40°01'52"	40°08'02"	35°32'23"
4°33'51"	1.1856	40°30'57"	40°38'15"	35°57'06"
4°38'15"	1.1742	40°59'46"	41°07'11"	36°21'31"
4°42'37"	1.1632	41°28'13"	41°35'46"	36°45'36"
4°47'00"	1.1525	41°56'23"	42°04'03"	37°09'22"
4°51'23"	1.1422	42°24'11"	42°31'59"	37°32'49"
4°55'46"	1.1323	42°51'43"	42°58'38"	37°55'57"
-----	-----	-----	-----	-----

X射线衍射角与面网间距换算表对照的方法^[2]，利用电子计算机对数据进行处理，列出CuK 辐射对不同 d 值时的 $\theta_{K\alpha_1}$, $\theta_{K\alpha_2}$, $\theta_{K\beta}$ 及 $\theta_{K\alpha_1} - \theta_{K\beta}(\delta)$ 0—90 度的系列表格（表 1 是部分 θ 间隔的数据）。只要测出某晶面的 δ 角差，就可直接查出 d 值来。将其与此晶体的粉末衍射卡中的数据进行对照，即可得出该晶面的指数。

测量某面 δ 值的方法很简便：只要把欲测的晶棒或晶片置于定向仪样品台上，吸附或紧靠样品台直立面，使 2θ 角以一定间距变化，然后转动 θ 角，定能找到一个至数个衍射信号，根据其衍射信号 2θ 大小可大致知道 θ 是多少（误差约 $\pm 2^\circ$ ）。若 θ 大于 30° ，则 $K\alpha_1$ 和 $K\alpha_2$ 可以分开（其差角也可以根据 θ 角大小估计）进行测定；若 θ 小于 30° ，则 $K\alpha_1$ 和 $K\alpha_2$ 很难分开，这时峰值读数是 $K\alpha$ 的位置。因为 θ 小于 30° ，其 $\theta_{K\alpha_1} - \theta_{K\alpha_2}$ 小于 $5'$ ，因此其峰值读数可视为 $\theta_{K\alpha_1}$ 。如果 θ 角小于 30° ，无法判断是 $K\alpha$ 还是 $K\beta$ 线，可加 Ni 滤光片检验。

在实际检测过程中，也许还会有其他因素的影响，使其衍射信号复杂化，但只要根据信号间的角度差值大小及其强度比例，就完全可以

判别。

二、测量精度分析

关于定向仪的测量误差同其他仪器设备一样不外有两种情况：一种是系统的，另一种偶然的。前者如样品的偏心、X射线的偏心、仪器的零点漂移等；后者如读数误差、峰值宽度大小等。

由于本方法采用测角差 δ 的方法，根据系统误差间的关系式 $\Delta\delta = \Delta\theta_{K\alpha_1} - \Delta\theta_{K\beta}$ ^[3]，而 $\Delta\theta_{K\alpha_1} \approx \Delta\theta_{K\beta}$ ，因此 $\Delta\delta \approx 0$ ，即利用此法本身可消除系统误差，具有线对法的优点。对于偶然误差，如果一个样品置于样品台不作任何移动，同时多次测量，其绝对误差对于丹东仪器厂生产的 YX-1 型定向仪来说，读数误差不大于 $30''$ 。但是，由于衍射峰较宽，峰值测量精度在不加单色仪情况下，一般为分量级，但这并不影响晶面指数的测定。

三、应用

根据实际鉴定工作的需要，我们实现了对

表 2

类别 数据 晶体	实测晶面 θ'_{hkl}		$\theta'_{K\alpha_1} - \theta'_{K\beta}$	查表得 d 值 (\AA)	卡片相近 d 值 (\AA)	hkl
	$\theta'_{K\alpha_1}$	$\theta'_{K\beta}$				
红宝石	38°40'15"	35°01'00"	3°39'15"	1.3753	1.374	030
	20°35'30"	18°32'30"	1°53'00"	2.372	2.379	110
	42°12'30"	37°40'30"	4°32'00"	1.190	1.189	220
	45°35'30"	40°46'15"	4°49'15"	1.1473	1.147	223
AgGaS ₂	14°01'30"	12°38'45"	1°22'45"	3.170	3.193	112
	20°27'00"	18°56'00"	1°31'00"	2.900	2.878	020
	37°21'15"	33°55'30"	3°26'45"	1.435	1.440	040
	35°41'00"	31°48'30"	3°52'00"	1.320	1.312	332
Nd:YAG	12°05'30"	11°12'30"	0°53'00"	4.830	4.890	211
	21°05'00"	19°17'15"	1°47'45"	2.478	2.45	422
	30°20'00"	27°38'30"	2°41'15"	1.750	1.734	444
金录石	18°30'00"	16°53'30"	1°36'30"	2.741	2.737	200
	18°10'00"	16°08'15"	2°01'45"	2.218	2.212	002

表 3

序号 数据 类 别	$\theta'_{K\alpha_1}$	$\theta'_{K\beta}$	$\theta'_{K\alpha_1} - \theta'_{K\beta}$	查表得 d 值 (Å)	卡片相近 d 值 (Å)	hkl
A	34°02'00"	30°22'45"	3°40'15"	1.371	1.374	0 3 0
1	22°58'15"	21°05'45"	1°52'45"	2.380	2.379	1 1 0
2	25°19'45"	23°09'15"	2°10'30"	2.087	2.085	1 1 3
	51°20'30"	45°35'00"	5°45'00"	1.042	1.0426	2 2 6
3	30°40'00"	27°40'15"	2°59'45"	1.597	1.601	1 1 6
4	24°40'15"	22°36'15"	2°04'00"	2.180	2.165	0 0 6
	49°07'30"	43°47'45"	5°19'45"	1.083	1.0831	0 0 12

红宝石、AgGaS₂、Nd:YAG 及金绿宝石等晶体的所需晶面指数的测定，并通过劳厄照相得到证实，其部分实例如表 2 所示。

对于同一 d 值，在高角度有可能代表几个面指数，从而对指标化带来一定困难，这可在操作过程中适当选择 2θ 范围得到克服。

另外，若要求定出一个晶棒或晶片的取向，仅测出一个晶面指数是无法实现的，必须找出几个主要的晶面指数，再根据有关极图或简单立体草图，便可以很快定出此晶体结晶学方位来。对于一轴晶棒状晶体，在其棒表面找到晶体的轴面的几率是很高的，因此利用此法再结合文献 [4] 的方法，定出晶棒的取向是很简便的。

表 3 是一提拉法生长的红宝石晶片的几个不同方位实测数据。图 1 是根据这些数据定红宝石晶片方位的立体草图。

X 射线定向仪是一种广泛应用的简单设

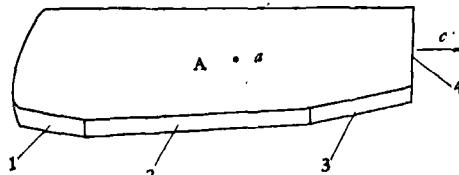


图 1 根据实测几个红宝石晶面指数定其方位的草图

备，目前应用面很窄，扩展其使用范围，解决晶体切割定向中的具体问题为人们所关心。本文仅对上述方法作一简单介绍，供有关人员参考。

本文初稿得到郭常霖、杨传铮等同志审阅指正，高余铭同志参加部分工作，样品来源于我单位各晶体生长组，在此一并致谢。

参 考 文 献

- [1] S. Popović, *J. Appl. Cryst.*, 4(1971), 240.
- [2] 张月明等，晶体 X 射线衍射角与面网间距换算表，科学出版社，(1966)。
- [3] S. Popović, *J. Appl. Cryst.*, 6(1973), 123.
- [4] 刘来保，物理，11-5(1982)，301--303。
- (上接第 719 页)
- Tokyo, Ed by T. Marumori, (1977), 474.
- [12] T. Kamae, *Nucl. Phys.*, A374(1982), 25.
- [13] C. Amsler et al., *Phys. Rev. Lett.*, 44(1980), 853.
- [14] B. Povh, *Nucl. Phys.*, A396(1983), 3.
- [15] M. Rozanski et al., *Nucl. Phys.*, B162(1980), 505.
- [16] R. Bhandari et al., *Phys. Rev. Lett.*, 46(1981), 1111.
- [17] W. Weise, *Nucl. Phys.*, A374(1982), 505; A396(1983), 373.
- [18] G. Goodman, *Nucl. Phys.*, A374(1982), 241.
- [19] W. Steffen et al., *Nucl. Phys.*, A404(1983), 413.